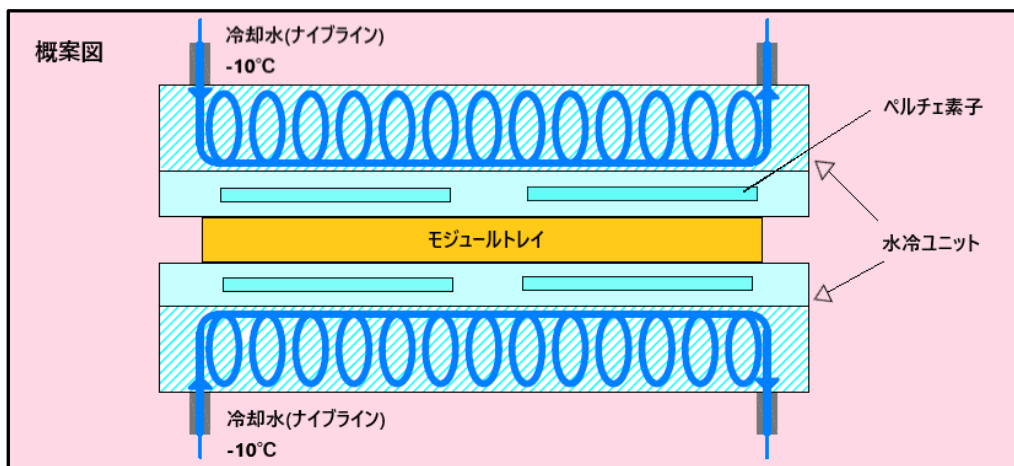
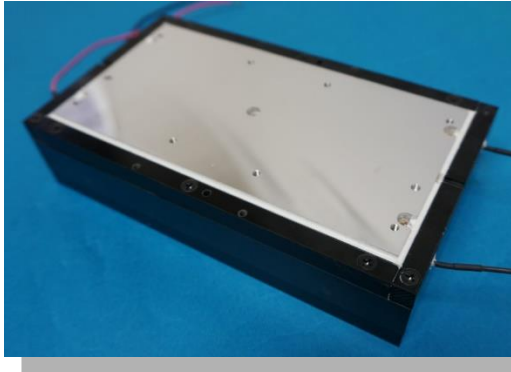


信頼性試験は温度環境試験から
ペルチェ冷熱プレートによる温度環境試験システム
-50℃から+130℃ プレート方式で信頼性の高い温度印加



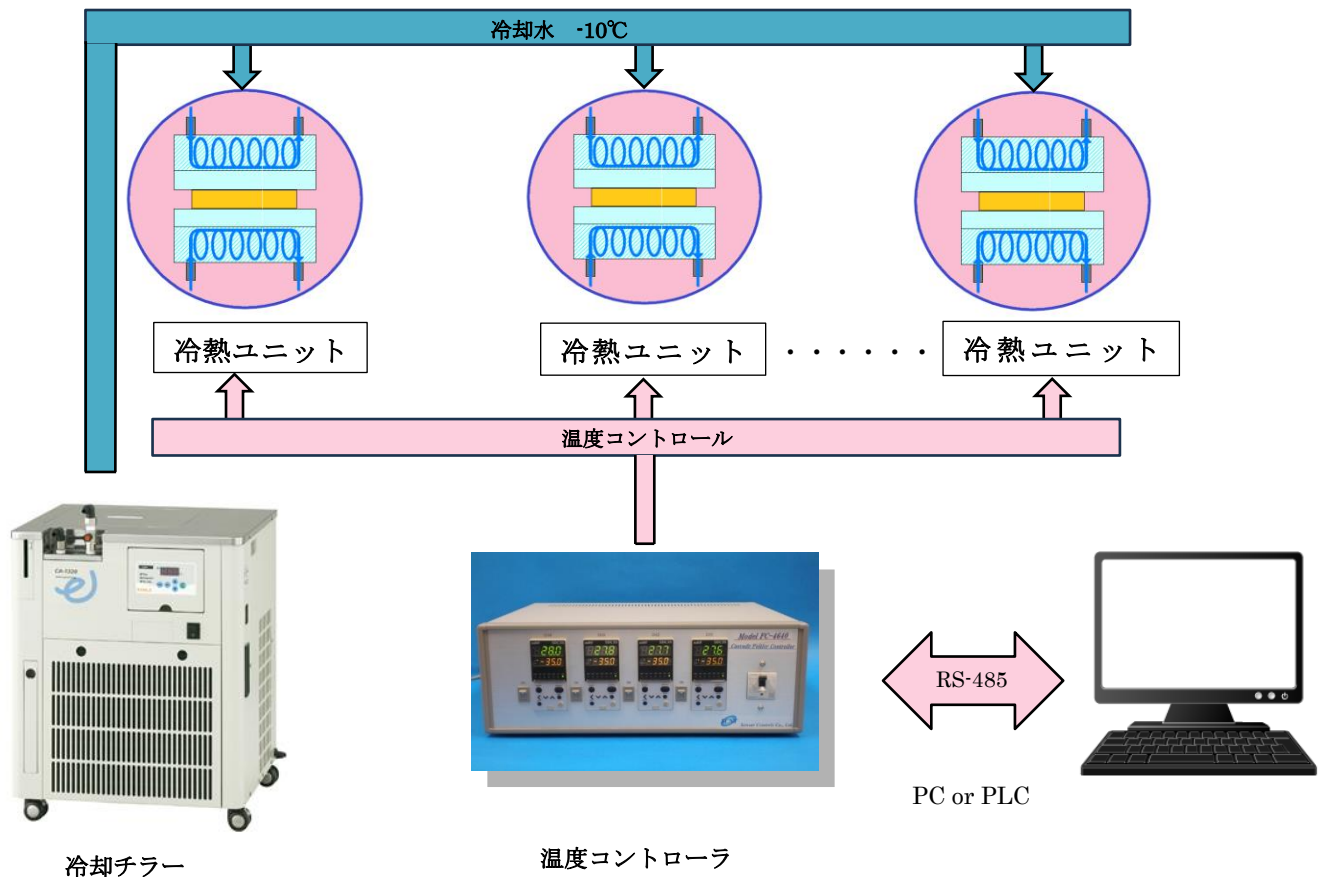
特 長

- ⚡ AEC-Q100 規格 『-40℃~+85℃』 “信頼性向上の為” 『-50℃~+125℃』 の温度環境試験システムの実施
- ⚡ ペルチェ冷熱プレートで温度サイクル試験が可能
- ⚡ 個々のデバイス表面温度を高精度に温度制御 (±0.1℃)
- ⚡ プレートサイズはデバイストレイに適合する 80 x 160 mm
- ⚡ 高効率ペルチェ素子使用により温度印加速度が速い 『-50℃⇒10分 +125℃⇒10分』
- ⚡ ノンフロン、カーボンニュートラル、地球温暖化対応、SDGs にも対応

仕 様

名 称	ペルチェ冷熱プレート
温度範囲 (℃)	-50 ~ +130
温度コントローラ	FC-3540 (4CH 温度コントローラ)
温度センサー	Pt100 白金測温抵抗体
放熱方式	水冷式 (冷却チラー使用)
ペルチェ素子	UT-7070x2
電源電圧 (V) / 電流 (A)	24 / 6.5
冷却プレートサイズ (mm)	80 x 160 x 50(H)
冷却チラー	別途打合せ

システム概要



概要

本システムは従来の温度環境試験システムの冷却と加熱機能を持つ高効率ペルチェ素子を使用した次世代型温度環境試験システムです。温度範囲は-60°C ~ +150°C (温度設定可能範囲)で PC と接続可能(RS-485)。温度サイクル試験が可能です。温度センサーは Pt100 白金測温抵抗体を使用しデバイスレイを素早く高精度に温調。従来高コストの為インライン導入が難しい温度環境試験システムがローコストで導入ができます。冷却ユニットは各々独立しておりメンテナンスも容易にできます。

